

บทที่ 2

การวิเคราะห์ชั้นพาสซีเวชัน

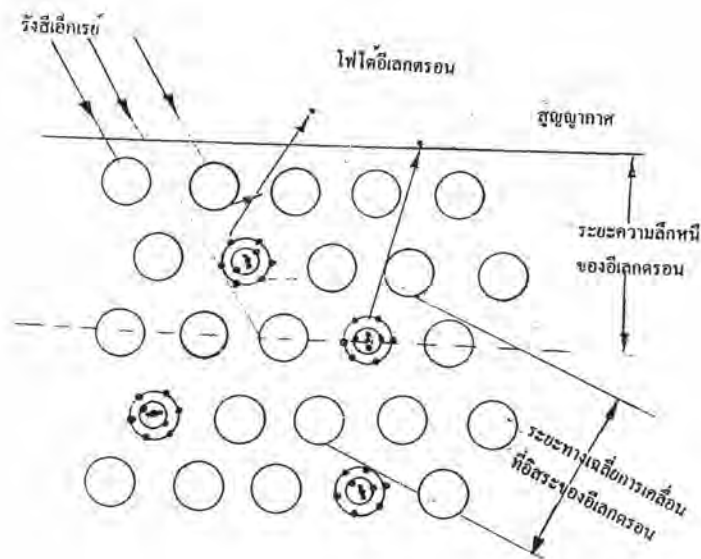
ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลกระทบของการทำแอโนดิกทรีตเมนต์ ก่อนที่จะทำแคโทดิกทรีตเมนต์ที่มีต่อชั้นพาสซีเวชันของดีบุก โดยจะทำการพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีและความหนาของชั้นพาสซีเวชัน เนื่องจากชั้นพาสซีเวชันที่เกิดขึ้นบนผิวชิ้นงานดีบุกนั้นบางมาก ดังนั้นจะต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์ โดยจะทำการวิเคราะห์องค์ประกอบของชั้นพาสซีเวชันซึ่งอยู่ลึกจากผิว 2-3 ชั้นของอะตอม และจะทำการปาดชั้นของอะตอมที่ทำการวิเคราะห์แล้วด้วยการกระแทกด้วยอ็อกซอนของธาตุอาร์กอน

เพื่อที่จะทำการวิเคราะห์องค์ประกอบของชั้นพาสซีเวชันที่ระดับลึกลงไปจากผิวเพิ่มขึ้น โดยในการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธี อิเล็กตรอนสเปกโทรสโคปี ฟอรัมัลเคอไมคัลแอนาไลซิส (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) ESCA หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เอ็กซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโคปี (X-ray Photoelectron Spectroscopy) XPS เป็นวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมี และองค์ประกอบของพื้นผิวบนของแข็ง โดยพิจารณาที่สเปกตรัมของโฟโตอิเล็กตรอน ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน

การเปลี่ยนแปลงของพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนในอะตอมซึ่งเรียกว่า เคมีคัลซีฟ และความหนาแน่นขององค์ประกอบ ที่วิเคราะห์ได้ โดยจะนำมาใช้ในงานวิจัยอย่างกว้างขวางสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพื้นผิว

ดังนั้นเพื่อที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพควรมีความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ผลและสามารถจะแปลผลของข้อมูลในรูปของ สเปกตรัมได้ โดยข้อมูลที่ได้อาจจะแสดงให้เห็นถึง การเกิดเคมีคัลซีฟ ของโฟโตอิเล็กตรอน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมี สเปกตรัมที่ได้จากการทดลอง ค่าตามแนวแกน (X) จะเป็นค่าของพลังงานยึดเหนี่ยว มีหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ โดยที่ค่าตามแนวแกน (Y) จะเป็นค่าจำนวนของโฟโตอิเล็กตรอน หน่วยที่ใช้จะเป็นหน่วยในการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของเครื่อง ESCA มาใช้ร่วมกับ ปืนอิเล็กตรอนซึ่งใช้ในการปาดชั้นอะตอมออกโดยการกระแทกด้วยอ็อกซอนของธาตุอาร์กอน สามารถทำการวิเคราะห์ องค์ประกอบของพื้นผิวที่ความลึกต่างๆ วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี โดยพิจารณาจากการเกิด เคมีคัลซีฟ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเคมี คัลบอนด์ ของอะตอมของธาตุ การเกิดโฟโตอิเล็กตรอน และการเกิดเคมีคัลซีฟ จะกล่าวถึงอิเล็กตรอนที่ปลดปล่อยออกมาจากชิ้นงาน เมื่อชิ้นงานได้รับคลื่นทางแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น รังสีอัลตราไวโอเล็ต หรือ รังสีเอ็กซ์ อิเล็กตรอนที่ปลดปล่อยออกมานี้เรียกว่า โฟโตอิเล็กตรอน

- ขั้นตอนการเกิดโฟโตอิเล็กตรอน ในชั้นงานจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักคือ
- ขั้นตอนที่ 1 รังสี เอ็กเรย์ จะถูกดูดกลืนในชั้นงาน ซึ่งจะเป็สาเหตุทำให้โฟโตอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ ออกจากอะตอม
- ขั้นตอนที่ 2 โฟโตอิเล็กตรอน เคลื่อนที่มาที่ผิวของชั้นงาน
- ขั้นตอนที่ 3 โฟโตอิเล็กตรอน เคลื่อนที่ออกจากผิวของชั้นงานเข้าสู่ สุญญากาศ ในที่สุด



ภาพที่ 2.1 แสดงขั้นตอนต่างๆของโฟโตอิเล็กตรอนขณะที่เคลื่อนที่มาที่ผิวของชั้นงาน

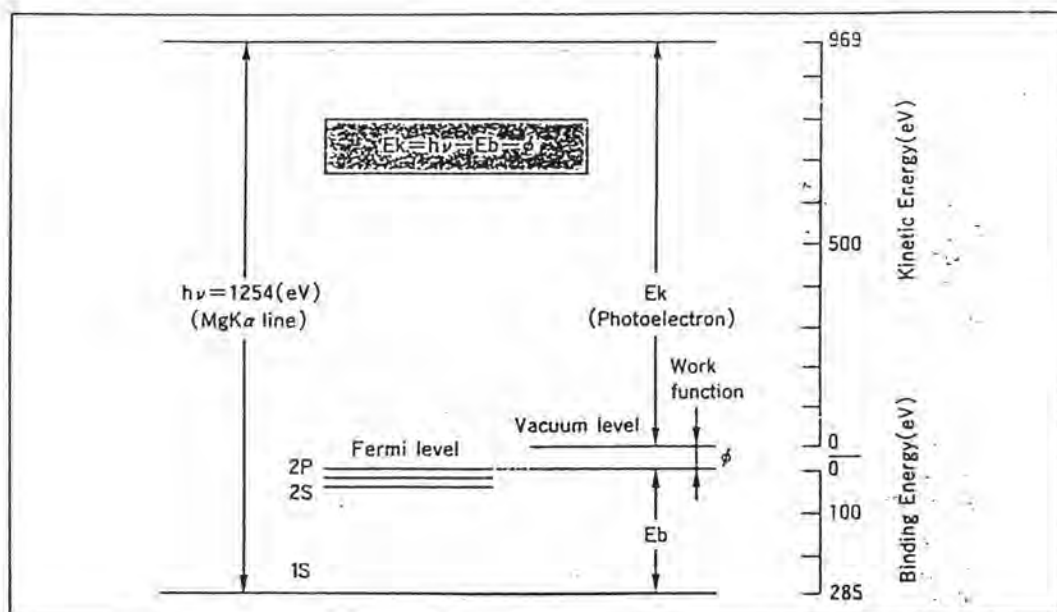
เมื่ออะตอมของชั้นงานที่สถานะพื้นฐานดูดกลืนรังสี เอ็กเรย์ (ภาพที่ 2.1) จะทำให้เกิดประจุขึ้น โดยสามารถไขกฎการทรงพลังงาน ระหว่างรังสีเอ็กเรย์ ($h\nu$) ที่ตกกระทบ และพลังงานของโฟโตอิเล็กตรอน (E_k) โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้

$$E_k = h\nu - E_b - \phi \quad (1)$$

พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนมีค่า	=	E_k	eV.
โดยที่พลังงานของรังสี เอ็กเรย์ ที่ตกกระทบมีค่า	=	$h\nu$	eV.
พลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนในอะตอม	=	E_b	eV.
โดยฟังก์ชันงานมีค่า	=	ϕ	eV.

เนื่องจากค่า พลังงานของรังสีเอ็กซ์ที่ตกกระทบ และ พลังงาน มีค่าคงที่ ดังนั้นพลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน สามารถหาค่าได้โดยมีค่าขึ้นกับ พลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนในอะตอม ที่อยู่ใน

ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวจะเป็นสิ่งที่แสดงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมและเป็นค่าเฉพาะสำหรับแต่ละองค์ประกอบ ดังนั้นจึงสามารถที่จะระบุองค์ประกอบต่างๆได้ โดยการวัดค่าพลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน



ภาพที่ 2.2 แสดงระดับพลังงาน ของโฟโตอิเล็กตรอนที่ปล่อยออกมาจากอะตอมคาร์บอน

ภาพที่ 2.2 จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระดับพลังงานต่างๆที่เกิดขึ้นขณะที่ โฟโตอิเล็กตรอนหลุดออกมาจากอะตอมคาร์บอนโดย

พลังงานของรังสีเอ็กซ์ ($h\nu$) ที่ให้ มีค่า 1254 eV

พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอน (E_k) มีค่า 969 eV

พลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน (E_b) มีค่า 285 eV